316 複数微小き裂に対する交流電位差法の評価

立命館大学院 学〇李 年慶 立命館大理工 正 坂根 政男 東芝(株) 正 平澤 泰治 東芝(株)正 久保 貴博

1. 緒 言

発電用ガスタービンや航空機エンジン用動翼の破損は、き裂の発生・伝ぱによるものであることがわかっている。これらの機器の安全性確保のためには定期的な検査または部品交換が必要をある。しかし、精度の高い非破壊検査法ががある。しかし、精度の高い非破壊検査法ががあるとから現状では保守的な評価をすることを持ている。これまでの研究報告にからき裂検出には交流電位差法が有効であることをわかっている。しかし、複数微小き裂んに対する研究例は少なく、本稿では同評価法の通用性を検討するために人工複数微小き裂の交流電位差法による検出実験を行なった。

2. 実験方法

本研究で用いた供試材は非磁性体の Ni基超合 \pm Incone1738LCである. 試験片は Fig. 1に示す5×10mmの長方形断面を有する角柱であり、ワイヤー放電加工機を用いて両端から30mm の所に次のようなき列を設けた. すなわち、深さが 50、100、150、200、300、500 μ mの模擬き裂をそれぞれ $1\sim5$ 本有する試験片を準備した.

交流電位差法計測システムを Fig. 2に示す.計測システムは4端子法を用いており、関数発生器により200Hzから5kHzまで7種類の周波数の交流正弦波を発生させ、それを交流アンプで1Aに増幅して端子A、A、から試験片に通電した.端子B、B、で検出された電位差をトランスによって100倍に増幅し、FFT解析器によって各周波数での電位差を計測した. さらに、FFT解析器からの信号をGP-IBインタフェイスを介してパーソナルコンピュータにデータを転送し、データ処理を行った.

3. 実験結果および考察

き裂進展に伴う電位差の変化をFig. 3に示す. き 裂の深さが深くなる程, すなわち, き裂深さが 深くなるのに伴って電位差が上昇しているのが 分かる.

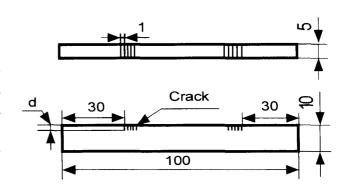


Fig. 1 Shape and dimensions of the specimen in millimeter.

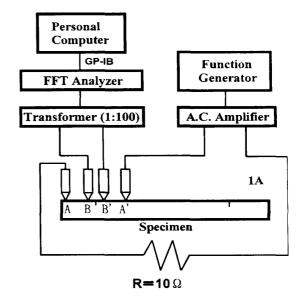
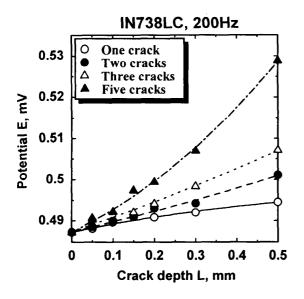


Fig. 2 Block diagram of the experimental apparatus

また、同一深さのき裂に対してはき裂の本数が増えるほど、電位差が上昇する. 紙面の都合上、グラフは200Hzおよび4kHzのみとしたが、すべての周波数で同様の傾向が観察された. また、き裂深さの増加に伴う電位差の絶対値は高周波になる程大きい.

き裂を有する場合の電位差Eをき裂の無い場合



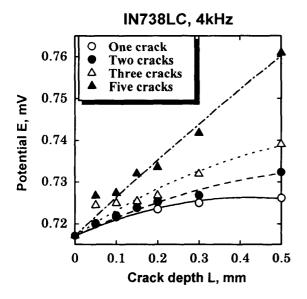
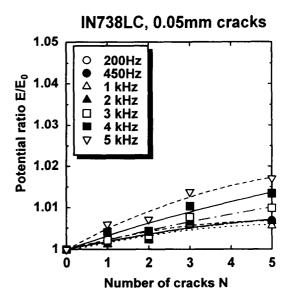


Fig. 3 Variation of the potential with crack propagation.

の電位差 E_0 で無次元化した結果をFig.4に示す。き裂深さが比較的浅い 50μ mのき裂では5kHzを用いた実験が最も高い電位差比を示しており,高周波を用いた方が浅いき裂の検出には有利であることがわかる。しかし,比較的き裂深さが深い 300μ mのき裂では,周波数に関係なくほぼ一本の直線上にデータ点があり,電位差比の周波数依存性がなくなっている。これはき裂が浅い程,より交流電流の表皮効果が顕著に現れためであると考えられる。

4. 結 言

1. 単独および複数き裂ともにき裂が深くなる



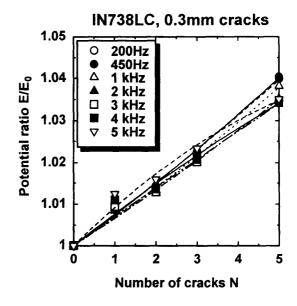


Fig. 4 Relationship between potential ratio and number of cracks at the same crack depth.

程電位差が上昇することがわかった.

- 同一深さのき裂本数の増加に伴って電位差が 上昇することがわかった。
- 3. 比較的浅いき裂に対しては高周波を用いた 方が感度が良いがき裂が深くなると検出さ れる電位差に周波数依存性がなくなること が判明した.

参考文献

 片山靖彦,坂根政男,大南正瑛,日本機械 学会論文集(A編),62巻,30(1996).